

# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

## «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

### ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01

### ОТЧЕТ

## по домашнему заданию №<u>1</u> Вариант 20

Название: Исслед	<u>цование характерис</u>	тик и моделирование	схем с
полупроводников	<u>ыми диодами</u>		
Дисциплина:	Электроника		
Студент	_ИУ6-42б_	ttes 08.03.2021	А.Е. Медведев
	(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель			В.А. Карпухин
		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

#### Домашнее задание №1

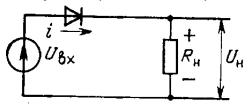
#### По дисциплине «Электроника»

### Для студентов 2 курса кафедры ИУ6, 2019 г.

## Исследование характеристик и моделирование схем с полупроводниковыми диодами

- 1. Для заданного диода найти и обосновать параметры SPICE-модели. Результат оформить в виде таблицы с объяснением соответствия найденных параметров параметрам SPICE-модели.
- 2. Для заданного диода по найденным параметрам SPICE-модели построить в среде MathCAD и в среде Multisim вольтамперные характеристики для режимов прямого и обратного смещения. Сравнить полученные графики.

Примечание: для измерения BAX в программе Multisim использовать следующую схему, измеряя ток и напряжение на диоде:

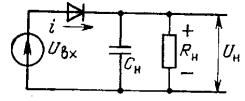


- 3. Для схемы (см. рисунок п.2) найти и построить зависимости тока, напряжения на диоде и выходного напряжения от входного напряжения в диапазоне от 0 до 10 В:
  - а) графически методом наложения характеристик. Использовать лист миллиметровой бумаги размером A4. Шаг по напряжению 1 В.
  - б) в среде Multisim.
  - Заданы: напряжение E и сопротивление R эквивалентного источника Uвх, сопротивление Rн нагрузки. Использовать нелинейную модель диода. Сравнить полученные результаты.
- 4. Для заданной схемы найти и построить зависимость выходного напряжения от времени при подаче на вход знакопеременного симметричного меандра с амплитудой 10 В и частотой 1 кГц на протяжении двух периодов меандра:
  - 1) Аналитически любым методом (классическим, операторным, преобразования Лапласа, интеграла Дюамеля) в среде MathCAD.
  - 2) В среде Multisim.

Использовать кусочно-линейную модель ВАХ диода. Напряжение открывания диода считать равным 0,7 В. Сопротивлением открытого p-n перехода пренебречь.

Сравнить полученные результаты.

Найти и сравнить полученные средние значения выходного напряжения и размах пульсаций p-p.



Вариант №	Тип диода	Ri, кОм	Rн, кОм	С1, нФ
20	2Д251А	3.099999999999	62	670

### 1) Расчет SPICE модели:

Для данного диода найти подходящий аналог не удалось. Значения для расчетов взяты с сайта <a href="http://chiplist.ru/diodes/2D251A/">http://chiplist.ru/diodes/2D251A/</a>

$$\varphi_{t} \approx 0.025$$
 — температурный потенциал

$$Inp = Is * \left(e^{\frac{Unp}{\varphi_r}} - 1\right)$$

$$10 = Is * \left(e^{\frac{50}{0.025 * 2}} - 1\right)$$

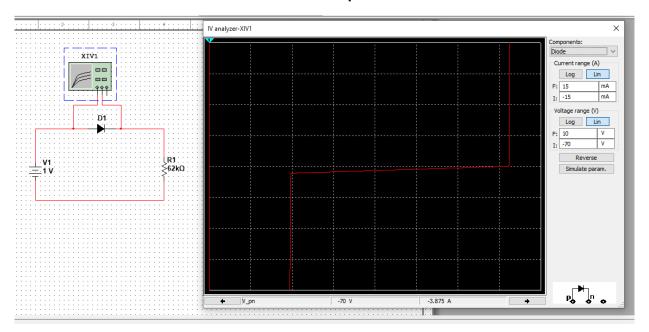
$$Is = 3,72E-43$$

$$Rs = \frac{Unp}{I} = \frac{50}{100} = 5$$

Остальные значения взяты по умолчанию с мультисима

прямой ток Inp прямое напряжение Uпр Ток насыщения (диодное Уравнение) (Is)* Паразитное сопротивление (последовательное сопротивление) (Rs)* Обратное напряжение пробоя (ВV) Бов В Коэффициент эмиссии (N) Время переноса заряда (ТТ) О с Емкость перехода при нулевом (СЈО) Контактная разность (VJ) Павности перехода (М) Ширина запрещенной зоны для Шоттки (ЕG) Показатель степени в формуле фликер-шума (АF) Коэффициент емкости Обедненной области при прямом смещении (FC) Обратный ток пробоя (IBV) Предельный ток пробоя низкого Уровня (IBVL) Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF) Параметр тока рекомбинации (ISR) Коэффициент неидеальности на участке пробоя инзкого уровня (NBVL) Коэффициент неидеальности на участке пробоя инзкого уровня (NBVL) Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на участке пробоя инзкого уровня (NBVL) Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV) Коэффициент эмиссии для тока ISR (NR)  Параметр тока рекомбинации (ISR) Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV) Коэффициент змиссии для тока ISR (NR)  Посельной ток пробоя (NBV)  Коэффициент змиссии для тока ISR (NR)		
Ток насыщения (диодное Уравнение) (Is)*  Паразитное сопротивление (последовательное сопротивление) (Rs)*  Обратное напряжение пробоя (ВV)  Коэффициент эмиссии (N)  Время переноса заряда (ТТ)  О С  Емкость перехода при нулевом (СЈО)  Контактная разность (VJ)  Па В  Коэффициент плавности перехода (М)  Ширина запрещенной зоны для Шоттки (ЕG)  Температурный экспоненциальный коэффициент тока насыщения для Шоттки (XTI)  Коэффициент фликер-шума (КF)  Показатель степени в формуле фликер-шума (AF)  Коэффициент емкости Обедненной области при прямом смещении (FC) Обратный ток пробоя низкого Уровня (IBVL)  Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF)  Параметр тока рекомбинации (ISR)  Коэффициент енидеальности на участке пробоя (NBV)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)  Помазкого уровня (NBVL)	прямой ток Іпр	10 A
Паразитное сопротивление (последовательное сопротивление) (Rs)* Обратное напряжение пробоя (BV) Время переноса заряда (ТТ) О с Емкость перехода при нулевом (CJO) Контактная разность (VJ) Коэффициент плавности перехода (М) Ширина запрещенной зоны для Шоттки (EG) Температурный экспоненциальный коэффициент тока насыщения для Шоттки (КТ) Коэффициент фликер-шума (КF) Показатель степени в формуле фликер-шума (АF) Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC) Обратный ток пробоя низкого Уровня (IBVL) Предельный ток пробоя ныском уровне инжекции (IKF) Параметр тока рекомбинации (ISR) Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBVL)	прямое напряжение Uпр	50 B
(последовательное сопротивление) (RS)*         50 В           Обратное напряжение пробоя (BV)         50 В           Коэффициент эмиссии (N)         2           Время переноса заряда (ТТ)         0 с           Емкость перехода при нулевом (СЈО)         0 Ф           Коэффициент плавности перехода (М)         1 В           Ширина запрещенной зоны для         1.11 эВ           Шоттки (ЕG)         3           Температурный экспоненциальный коэффициент тока насыщения для Шоттки (ХТІ)         3           Коэффициент фликер-шума (КF)         0           Показатель степени в формуле фликер-шума (АF)         1           Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC)         0.5           Обратный ток пробоя (IBV)         0.0000000001 A           Начальный ток пробоя низкого уровня (IBVL)         1           Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF)         1           Параметр тока рекомбинации (ISR)         0 A           Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)         1           Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)         1	Ток насыщения (диодное Уравнение) (Is)*	3,72E-43 A
Обратное напряжение пробоя (ВV)         50 В           Коэффициент эмиссии (N)         2           Время переноса заряда (ТТ)         0 с           Емкость перехода при нулевом (СЈО)         0 Ф           Контактная разность (VJ)         1 В           Коэффициент         0.5           плавности перехода (М)         1.11 эВ           Шоттки (ЕG)         3           Температурный экспоненциальный коэффициент тока насыщения для Шоттки (ХТІ)         3           Коэффициент фликер-шума (КF)         0           Показатель степени в формуле фликер-шума (AF)         0           Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC)         0.5           Обратный ток пробоя (ивV)         0.0000000001 A           Начальный ток пробоя низкого уровня (ивVL)         1 А           Предельный ток при высоком уровне инжекции (икF)         1 ОА           Параметр тока рекомбинации (ISR)         0 А           Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)         1           частке пробоя низкого уровня (NBVL)         1	Паразитное сопротивление	5 Ом
Коэффициент эмиссии (N)  Время переноса заряда (ТТ)  О С  Емкость перехода при нулевом (СЈО)  Контактная разность (VJ)  Коэффициент плавности перехода (М)  Ширина запрещенной зоны для  Шоттки (EG)  Температурный экспоненциальный коэффициент тока насыщения для Шоттки (ХТІ)  Коэффициент фликер-шума (КF)  Показатель степени в формуле фликер-шума (АF)  Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC)  Обратный ток пробоя (IBV)  Лованальный ток пробоя низкого Уровня (IBVL)  Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF)  Параметр тока рекомбинации (ISR)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBVL)		
Время переноса заряда (ТТ) 0 с  Емкость перехода при нулевом (СЈО) 0 Ф  Контактная разность (VJ) 1 В  Коэффициент плавности перехода (М)  Ширина запрещенной зоны для Шоттки (ЕG)  Температурный экспоненциальный коэффициент тока насыщения для Шоттки (XTI)  Коэффициент фликер-шума (КF) 0  Показатель степени в формуле фликер-шума (АF)  Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC)  Обратный ток пробоя (IBV)  Предельный ток пробоя низкого Уровня (IBVL)  Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF)  Параметр тока рекомбинации (ISR)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBVL)	Обратное напряжение пробоя (BV)	
Емкость перехода при нулевом (СЈО)       0 Ф         Контактная разность (VJ)       1 В         Коэффициент плавности перехода (М)       0.5         Ширина запрещенной зоны для Шоттки (ЕG)       1.11 эВ         Температурный экспоненциальный коэффициент тока насыщения для Шоттки (ХТІ)       3         Коэффициент фликер-шума (КF)       0         Показатель степени в формуле фликер-шума (AF)       1         Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC)       0.5         Обратный ток пробоя (IBV)       0.0000000001 A         Начальный ток пробоя низкого уровня (IBVL)       1 A         Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF)       1.00E+30 A         Параметр тока рекомбинации (ISR)       0 A         Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)       1         Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)       1	Коэффициент эмиссии (N)	2
Контактная разность (VJ)  Коэффициент плавности перехода (M)  Ширина запрещенной зоны для  Шоттки (EG)  Температурный экспоненциальный коэффициент тока насыщения для Шоттки (XTI)  Коэффициент фликер-шума (КF)  Показатель степени в формуле фликер-шума (AF)  Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC)  Обратный ток пробоя (IBV)  Начальный ток пробоя низкого Уровня (IBVL)  Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF)  Параметр тока рекомбинации (ISR)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)	Время переноса заряда (ТТ)	0 c
Коэффициент плавности перехода (М)  Ширина запрещенной зоны для Шоттки (ЕG)  Температурный экспоненциальный коэффициент тока насыщения для Шоттки (ХТI)  Коэффициент фликер-шума (КF)  Показатель степени в формуле фликер-шума (АF)  Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC)  Обратный ток пробоя (IBV)  Предельный ток пробоя низкого Уровня (IBVL)  Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF)  Параметр тока рекомбинации (ISR)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)	Емкость перехода при нулевом (CJO)	0 Ф
плавности перехода (М)  Ширина запрещенной зоны для Шоттки (ЕG)  Температурный экспоненциальный коэффициент тока насыщения для Шоттки (XTI)  Коэффициент фликер-шума (КF)  Показатель степени в формуле фликер-шума (АF)  Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC)  Обратный ток пробоя (IBV)  Предельный ток пробоя низкого уровня (IBVL)  Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF)  Параметр тока рекомбинации (ISR)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)	Контактная разность (VJ)	1 B
Ширина запрещенной зоны для Шоттки (EG) Температурный экспоненциальный коэффициент тока насыщения для Шоттки (XTI) Коэффициент фликер-шума (КF) Показатель степени в формуле фликер-шума (AF) Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC) Обратный ток пробоя (IBV) Предельный ток пробоя низкого Уровня (IBVL) Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF) Параметр тока рекомбинации (ISR) Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)	Коэффициент	0.5
Шоттки (EG) Температурный экспоненциальный коэффициент тока насыщения для Шоттки (XTI) Коэффициент фликер-шума (KF) Показатель степени в формуле фликер-шума (AF) Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC) Обратный ток пробоя (IBV) Начальный ток пробоя низкого 1 A Уровня (IBVL) Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF) Параметр тока рекомбинации (ISR) Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)	плавности перехода (М)	
Температурный экспоненциальный коэффициент тока насыщения для Шоттки (XTI)  Коэффициент фликер-шума (КF)  Показатель степени в формуле фликер-шума (AF)  Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC)  Обратный ток пробоя (IBV)  Начальный ток пробоя низкого уровня (IBVL)  Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF)  Параметр тока рекомбинации (ISR)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)		1.11 эB
тока насыщения для Шоттки (XTI)  Коэффициент фликер-шума (КF)  Показатель степени в формуле фликер-шума (АF)  Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC)  Обратный ток пробоя (IBV)  Начальный ток пробоя низкого Уровня (IBVL)  Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF)  Параметр тока рекомбинации (ISR)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)		
Коэффициент фликер-шума (КF)       0         Показатель степени в формуле фликер-шума (AF)       1         Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC)       0.5         Обратный ток пробоя (IBV)       0.000000001 A         Начальный ток пробоя низкого Уровня (IBVL)       1 A         Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF)       1.00E+30 A         Параметр тока рекомбинации (ISR)       0 A         Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)       1         Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)       1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3
Показатель степени в формуле фликер-шума (АF)  Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC) Обратный ток пробоя (IBV) Начальный ток пробоя низкого Уровня (IBVL) Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF) Параметр тока рекомбинации (ISR) Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)		
фликер-шума (AF)  Коэффициент емкости  обедненной области при прямом смещении (FC)  Обратный ток пробоя (IBV)  Начальный ток пробоя низкого Уровня (IBVL)  Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF)  Параметр тока рекомбинации (ISR)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)	11111111111	-
Коэффициент емкости обедненной области при прямом смещении (FC) Обратный ток пробоя (IBV) Обратный ток пробоя низкого Уровня (IBVL) Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF) Параметр тока рекомбинации (ISR) Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)		
обедненной области при прямом смещении (FC) Обратный ток пробоя (IBV) Обратный ток пробоя низкого Уровня (IBVL) Предельный ток при высоком Уровне инжекции (IKF) Параметр тока рекомбинации (ISR) Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)		0.5
Смещении (FC) Обратный ток пробоя (IBV) Обратный ток пробоя низкого Начальный ток пробоя низкого Уровня (IBVL) Предельный ток при высоком Уровне инжекции (IKF) Параметр тока рекомбинации (ISR) Коэффициент неидеальности на Участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на Участке пробоя низкого уровня (NBVL)	1	0.5
Обратный ток пробоя (IBV)  Начальный ток пробоя низкого Уровня (IBVL)  Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF)  Параметр тока рекомбинации (ISR)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)		
Начальный ток пробоя низкого Уровня (IBVL) Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF) Параметр тока рекомбинации (ISR) Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)		0.000000001 Δ
Уровня (IBVL) Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF) Параметр тока рекомбинации (ISR) Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)		
Предельный ток при высоком уровне инжекции (IKF) Параметр тока рекомбинации (ISR)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)	·	1 7
уровне инжекции (IKF) Параметр тока рекомбинации (ISR)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV)  Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня (NBVL)		1.00E+30 A
Коэффициент неидеальности на участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на 1 участке пробоя низкого уровня (NBVL)		
участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на 1 участке пробоя низкого уровня (NBVL)		0 A
участке пробоя (NBV) Коэффициент неидеальности на 1 участке пробоя низкого уровня (NBVL)	Коэффициент неидеальности на	1
участке пробоя низкого уровня (NBVL)	участке пробоя (NBV)	
		1
Коэффициент эмиссии для тока ISR (NR) 1		
	Коэффициент эмиссии для тока ISR (NR)	1

2)По заданным параметрам была создана схема и при помощи инструмента IV analyzer был построен график зависимости тока от напряжения

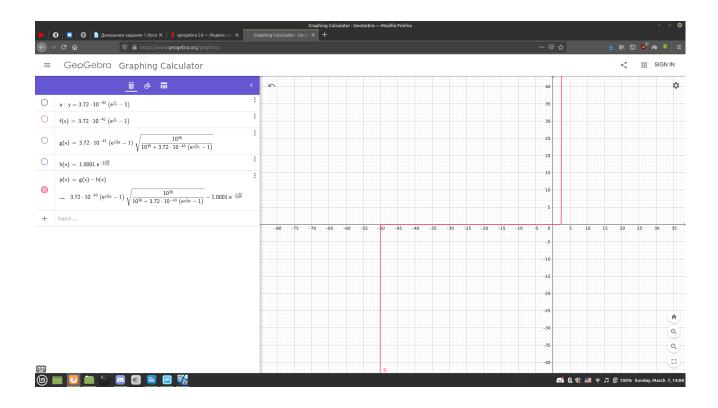


Рассчитаем функцию зависимости тока от напряжения (вах):

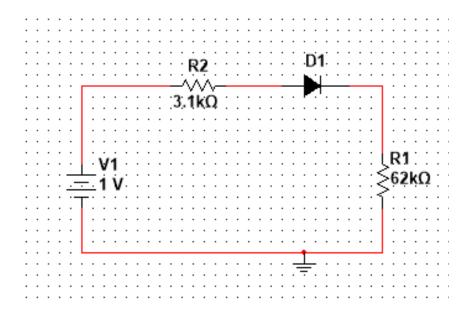
$$\begin{split} &I(U) = I_{fwd} - I_{rev} = \left(I_n K_{inj} + I_r K_{gen}\right) - \left(I_{rev.hight} + I_{rev.low}\right) = \\ &= \left(\left(IS\left[e^{\left[\frac{U}{NR + \varphi_i}\right]} - 1\right]\right) \left(\sqrt{\frac{IKF}{IKF + \left(IS\left[e^{\left[\frac{U}{NR + \varphi_i}\right]} - 1\right]\right)}\right) + \left(ISR\left[e^{\left[\frac{U}{NR + \varphi_i}\right]} - 1\right]\right) \left(\left[\left(\frac{1 - V}{VJ}\right)^2 + 0.005\right]^{\frac{M}{2}}\right) - \left(\left(IBV * e^{\left[\frac{U - V}{NBV + \varphi_i}\right]}\right) + \left(IBVL * e^{\left[\frac{U - V + BV}{NBVL + \varphi_i}\right]}\right)\right) = \left(3,72E - 43 * \left(e^{\left[\frac{U}{2 + 0.025}\right]} - 1\right)\right) * \\ &+ \left(0 * \left[e^{\left[\frac{U}{2 + 0.025}\right]} - 1\right]\right) * \left(\left[\left(\frac{1 - V}{1}\right)^2 + 0.005\right]^{\frac{M}{2}}\right) - \left(\left(0.00000000001 * e^{\left[\frac{U - V + IA}{2 + 0.025}\right]}\right) + \left(1 * e^{\left[\frac{U - V + IA}{2 + 0.025}\right]}\right)\right) = \end{split}$$

$$\sqrt{\frac{(1.00E+30)}{(1.00E+30)+((3,72E-43)\left\{e^{\left[\frac{U}{2+0.025}\right]}-1\right\})}} - 1.0000000001 * e^{\left[\frac{-U+50}{2+0.025}\right]}$$

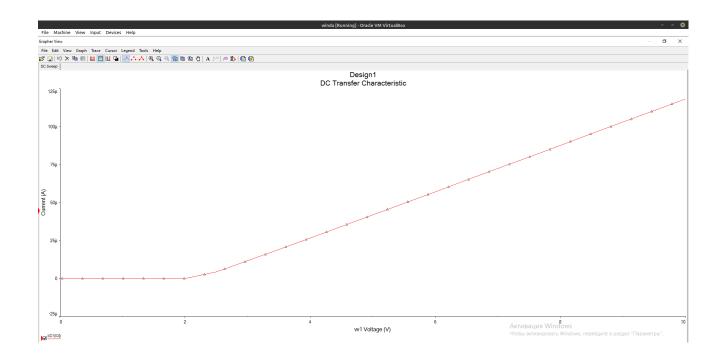
# По полученной формуле был построен график зависимости тока от напряжения отдельно от multisim:



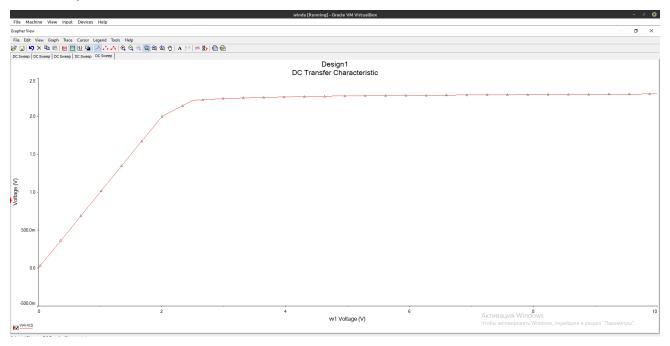
3) С учетом внутреннего сопротивления  $R_i$  перестроим предыдущую схему



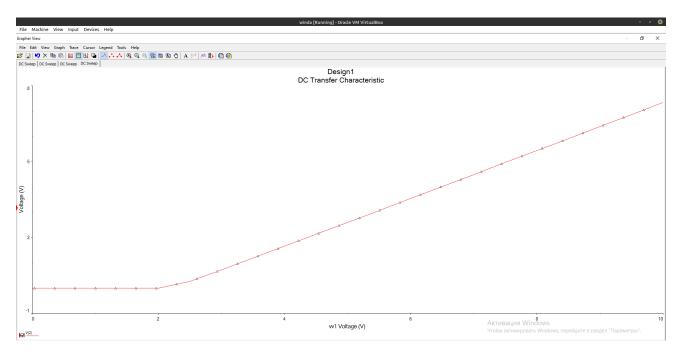
# С помощью анализа dc sweep был построен график зависимости тока на диоде от напряжения источника



## Зависимость напряжения на диоде от входного напряжения



## Зависимость выходного напряжения от входного напряжения

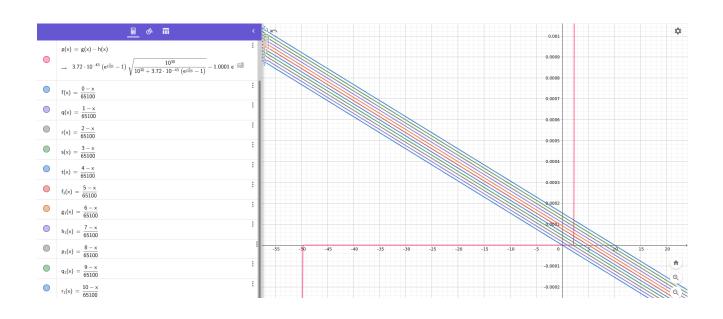


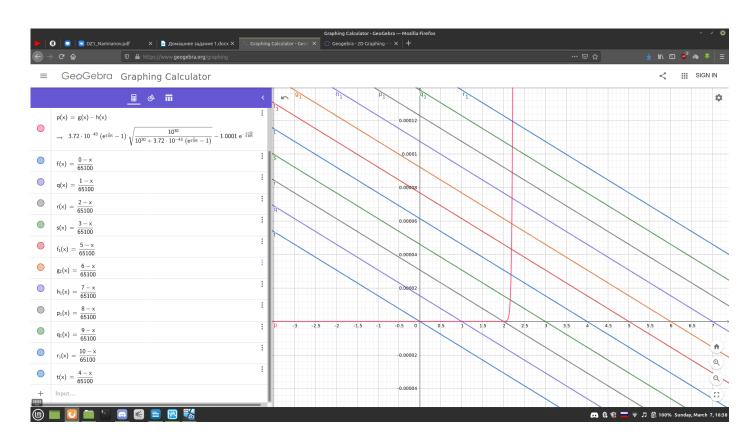
Для построения зависимости тока, напряжения на диоде и выходного напряжения от входного напряжения я воспользовался функцией ВАХ  $I(U) = I_{fwd} - I_{rev}$  расчитанной выше.

Затем находим пересечение вах с линиями нагрузки, которые рассчитываются по формуле

$$\frac{E-U_g}{R_i+R_h}=I_g$$

, где  $^{\it E}$  необходимо изменять от  $^{\it O}$  до  $^{\it 10}$  В



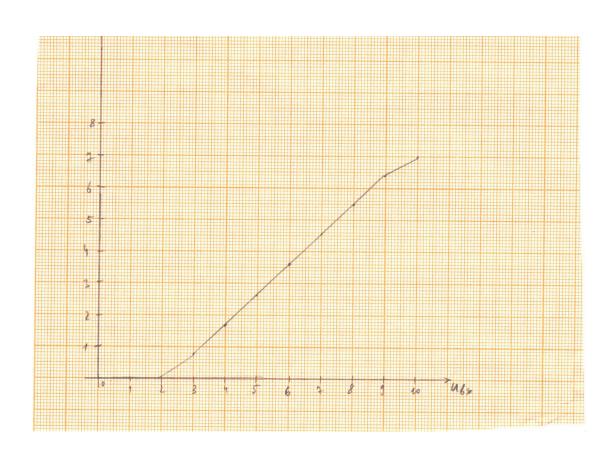


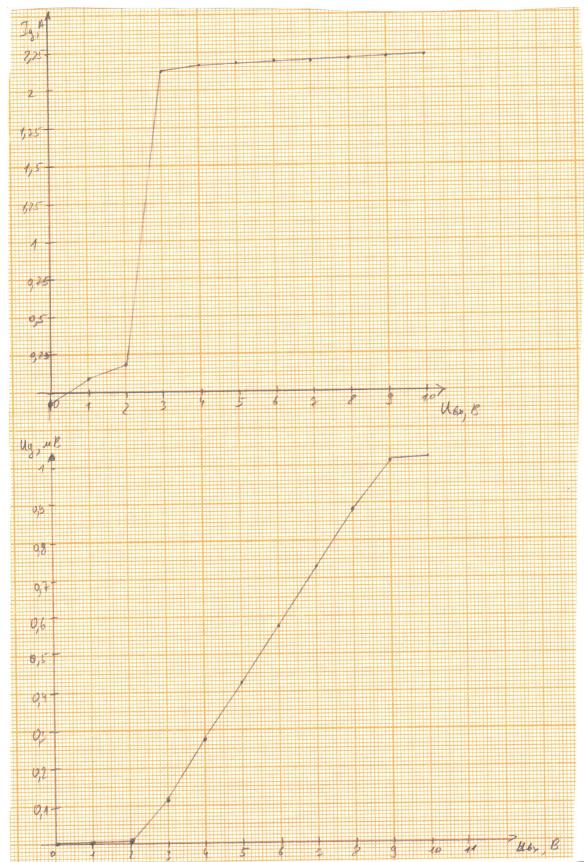
## Находим точки пересечения

E	(x,y)	$U\partial = y * R_{\scriptscriptstyle H}$
0	-0.006 0	0
1	0.1 0.0	0
2	0.1999 0.0	0
3	2.16 0.0000129	0.7998
4	2.18 0.0000279	1.7298
5	2.1911 0.0000432	2.6784
6	2.199 0.00005839	3.62
7	2.205 0.0000737	4.5694
8	2.209 0.0000889	5.5118
9	2.213 0.000104	6.448
10	2.217 0.00012	7.14

Затем также нужно соединить координаты точек при этом за координату X надо брать E, которое мы изменяем от 0 до 10, а за координату У берём координаты (X, Y) точек пересечения, и отдельно координату У точки пересечения умноженной на сопротивление нагрузки.

Эти линии и есть зависимости тока, напряжения на диоде и выходного напряжения от входного напряжения в диапазоне от 0 до 10 В.





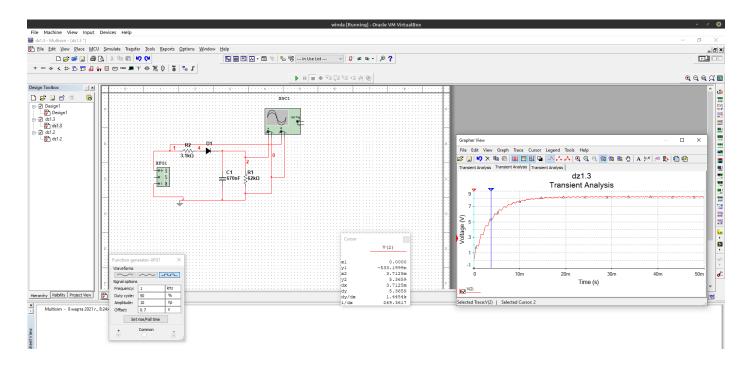
4) Для построения графика выходного напряжения от времени при источнике напряжения в виде знакопеременного меандра я использовал

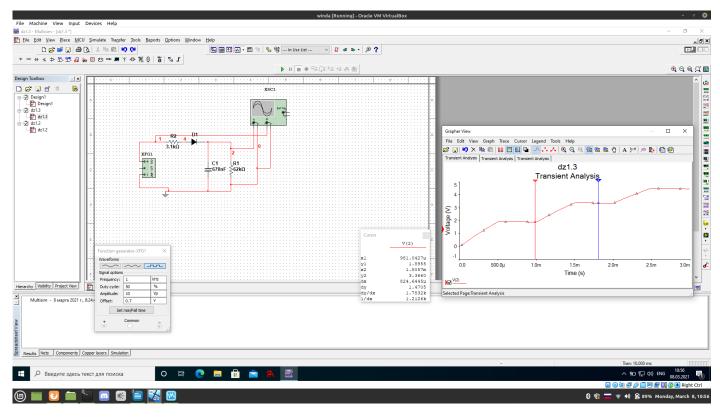
классический метод.

По частоте находим период:  $T = \frac{1}{v} = \frac{1}{1000} = 0.001$ 

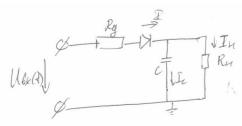
Полупериод найдем по следующей формуле

$$T_{non} = \frac{T + 2}{4} = 0.0005$$





Так как напряжение открытия диода считается равным 0.7, мы будем рассматривать что напряжение на входе равно 10 -0.7 = 9,3 Тогда получим такую схему для положительной полуволны Для классического метода:



Megbegll U46-4215

Uls = 10E-0,38=9,3B

To In I zm. Rup 20 gpa.

$$\begin{cases} U \delta_{x}(t) = I(t) R_{y} + U_{c}(t) \\ 0 = -U_{c}(t) + I_{n}(t) R_{n} \\ I(t) = i_{c}(t) + i_{n}(t) \end{cases}$$

$$\frac{U6x(t) - Uc(t)}{Rg} = C \frac{dUc}{dt} + \frac{Uc(t)}{RH}$$

$$C \frac{JUc}{Jt} + Uc \left(\frac{1}{RH} + \frac{1}{Rg}\right) = \frac{Udio(t)}{Ry}$$

$$p = -\frac{R_H + R_g}{CR_g R_H} = -500$$

$$p = -\frac{R_H + R_g}{CR_g R_H} = -500$$
  $\ell = \frac{1}{107} = \frac{1}{1-5001} = 2mc$ 

$$t_2 = 1000 | y = 7 = 7 = 0,0012$$
  
 $t_2 = 0$   
 $t_3 = \frac{37}{2} = 1,5mc$   $t_4 = 27 = 2ms$ 

$$U_{cnp} = \frac{U_{bx}}{R_g + R_H} \cdot R_H = \frac{9,3}{65,1.10^3} \cdot 62 \cdot 10^3 = 8,86 \text{ B}$$

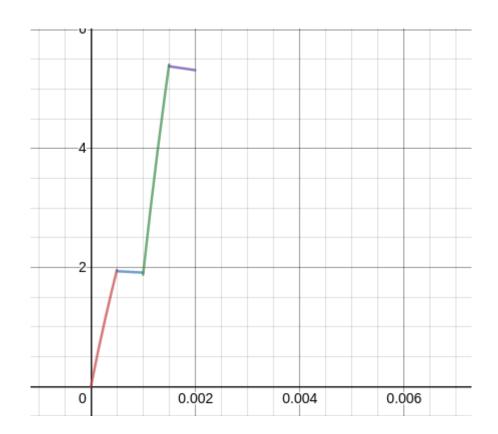
2) 
$$t_1 \le t \le t_2$$

The sym of physicisms meaning for representations  $t_1 \le t \le t_2$ 
 $t_2 \le t_3 \le t_4 \le t_5$ 
 $t_3 \le t_4 \le t_5 \le t_5$ 
 $t_4 \le t_5 \le t_5$ 
 $t_5 \le t_5 \le t_5$ 
 $t_7 \le t_5 \le t_5$ 
 $t_7 \le t_7 \le t_7$ 
 $t_7 \le$ 

$$U_c(t_1) = 0 + 1,962 - 24,07.0,0001$$

3) 
$$f_2 \le t \le t_3$$
  
 $U_{CH}(t_2) = U_{CK}(t_2) = 1,91$   
 $U_{CH} = 8,86$   $-1,91 = 8,86 + A => A = -6,95$   
 $U_{C}(t_3) = 8,86 - 6,95e^{-500.0,0015} = 5,58$ 

4) 
$$f_3 \le f \le f_4$$
  
 $U_{CH}(f_3) \ge U_{CK}(3) \ge 5,58$ ;  $U_{CM} \ge 0$   
 $f_2 = 5,58$ ;  
 $U_C(f_4) \ge 5,58e^{-24,03\cdot0,002} = 5,32B$ 



**Вывод:** В ходе решения домашнего задания был рассмотрен диод 2Д251А, исследованы переходные процессы в полупроводниковом диодном фильтре.